

УДК 543.42

АНОМАЛИИ ЭКСИТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В ГИДРОСТАТИЧЕСКИ СЖАТОМ КРИСТАЛЛЕ ДЕЙТЕРОНАФТАЛИНА

К. П. Мелетов

Измерены спектры экситонного поглощения кристалла дейтеронафталина при $T=4.2$ К и гидростатическом сжатии до 12 кбар для двух поляризаций света — параллельной и перпендикулярной к моноклинной b -оси. Обнаружено резкое уменьшение интенсивности полосы поглощения А-экситона вплоть до ее исчезновения при давлении ~ 9 кбар. При дальнейшем увеличении давления полоса вновь появляется в спектре и ее интенсивность растет. Измерено поляризационное отношение для полосы изотопической примеси и обнаружена его немонотонная зависимость от давления. Обсуждены поляризационные свойства экситонных полос поглощения и возможные причины их необычного поведения.

Разработка методики спектральных измерений при гидростатическом сжатии с использованием камер высокого давления типа наковален открывает новые возможности для исследований энергетического спектра молекулярных кристаллов, дающих важную информацию о межмолекулярном взаимодействии, ответственном за трансформацию молекулярного спектра в кристаллический [1, 2]. В результате в последнее время получены новые экспериментальные данные о природе сил резонансного взаимодействия кристаллов антрацена и нафталина [3, 4], указывающие на их близкодействующий характер. Они подтверждают представление о том, что в формировании этих сил важную роль играет обменное взаимодействие, обусловленное перекрытием электронных орбиталей близкорасположенных пар молекул [5]. Межмолекулярное взаимодействие определяет не только сдвиг электронных уровней молекулы в кристалле и образование экситонного спектра, но и поляризационные свойства экситонных полос и их интенсивность. В частности, интенсивность экситонного поглощения может значительно изменяться из-за конфигурационного смешивания различных электронных состояний молекулы, происходящего в кристалле под влиянием кристаллического поля [6]. Последнее обстоятельство особенно существенно для кристаллов бензола и нафталина, у которых слабые электронные переходы в свободной молекуле усиливаются в кристалле благодаря конфигурационному смешиванию [7]. В случае кристалла нафталина это, по-видимому, является причиной значительного различия интенсивностей полос поглощения В- и А-экситонов, поляризационное отношение для которых $P_{b/a}^0 \sim 10^2$ на два порядка превышает предсказываемую моделью ориентированного газа [МОГ] величину $P_{b/a}^0 = 0.24$. Поскольку эффективность конфигурационного смешивания увеличивается при сближении соответствующих электронных уровней, а гидростатическое сжатие кристаллов сопровождается сдвигом и сближением молекулярных термов двух экситонных переходов, представляется заманчивым использовать этот метод для изучения роли конфигурационного смешивания в формировании нижайшего синглетного экситонного перехода.

В настоящей работе выполнено экспериментальное исследование спектров экситонного поглощения кристалла дейтеронафталина с при-

месью нафтилина при $T=4.2$ К и гидростатическом сжатии до 12 кбар для двух направлений поляризации света. Получены спектры оптической плотности и определена зависимость от давления поляризационного отношения $P_{b/a}$ для изотопической примеси, связанного известными соотношениями теории квазирезонанса [7] с поляризационным отношением $P_{b/a}^0$ для экситонного давыдовского дублета кристалла. Обнаружено, что экспериментальная зависимость имеет немонотонный характер. Вместе с тем обнаружена необычная зависимость интенсивности полосы А-экситона от давления, спадающая практически до нуля при $p \approx 9$ кбар с последующим ростом.

1. Экспериментальные результаты

Измерения проводились на монокристаллах дейтеронафтилина, выращенных сублимацией из химически чистого препарата, предварительно очищенного зонной плавкой. Исходное вещество специально не легировалось, а остаточная концентрация нафтилина составляла примерно 0.1 %. Для измерений отбирались кристаллы с развитой плоскостью (ab) толщиной до 20 мкм с параллельными гранями, качество которых контролировалось по интерференционной окраске в скрещенных поляризаторах. Гидростатическое сжатие осуществлялось с помощью камеры высокого давления с лейкосапфировыми наковальнями по методике, позволяющей проводить низкотемпературные спектральные измерения в поляризованном свете. Калибровка давления проводилась по рубиновой шкале как при комнатной, так и при гелиевой температурах [8, 9].

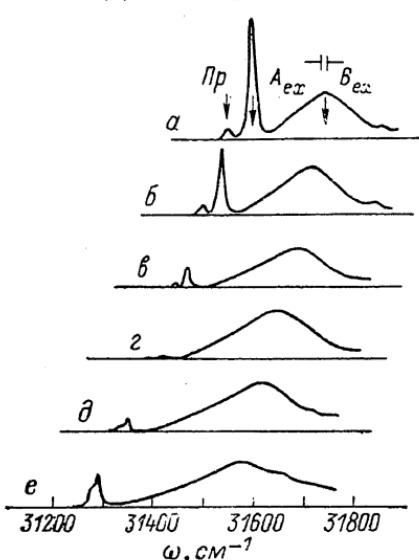


Рис. 1. Спектры экситонного поглощения гидростатически сжатого дейтеронафтилина при $T=4.2$ К и поляризации \parallel а.
а — 0, б — 3.1, в — 6.7, г — 8.8, д — 10.6, е — 11.7 кбар.

Спектры поглощения регистрировались по оптической схеме с промежуточной скрещенной щелью, выделявшей из увеличенного изображения кристалла участки размером 100×100 мкм. Для измерений использовалась центральная часть кристалла, а контроль в процессе измерений исключал смещение выбранного участка. Спектры оптической плотности вычислялись с помощью управляющей экспериментом микро-ЭВМ, в память которой закладывались данные о спектре излучения используемой ксеноновой лампы.

На рис. 1 приведены спектры поглощения в области нижайшего синглетного экситонного перехода при $T=4.2$ К для поляризации света \parallel а и нескольких значений давления. Оптическая плотность измерена в единицах для всех значений давления условных единицах и соотношение интенсивностей линий в спектрах соответствует их реальному значению. Спектр поглощения в этой поляризации при нормальном давлении содержит узкую интенсивную полосу А-экситона ($\omega = 31\ 588$ см $^{-1}$, представление B_u , фактор — группа C_{2h}) и широкую полосу В-экситона ($\omega = 31\ 739$ см $^{-1}$, представление A_u), обусловленную ее частичной (3—5 %) деполяризацией. В поляризации \parallel в интенсивность полосы А-экситона равна нулю, а интенсивность полосы В-экситона примерно в 20—30 раз больше. Поляризационное отношение $P_{b/a}^0$ полос В- и А-экситонов составляет примерно 10^2 [10]. С длинноволновой стороны от полосы А-экситона

расположена слабая полоса поглощения примеси нафталина ($\omega_{00} = 31\ 542\ \text{см}^{-1}$), поляризационное отношение для которой при нормальном давлении составляет ~ 4.8 .

С увеличением давления полосы сдвигаются в красную сторону спектра, при этом расстояние между полосами А- и В-эксситонов растет, а между полосами примеси и А-эксситона уменьшается. Эта особенность спектра эксситонного поглощения кристалла нафталина отмечалась ранее [11], здесь хотелось бы обратить внимание на интенсивность полос. Как видно из рис. 1, интенсивность полосы В-эксситона практически постоянна, в то время как интенсивность полос А-эксситона и примеси меняется с ростом давления. Первоначально пикивая интенсивность полосы А-эксситона падает, и при давлении ~ 9 кбар она едва заметна в спектре. Затем с по-

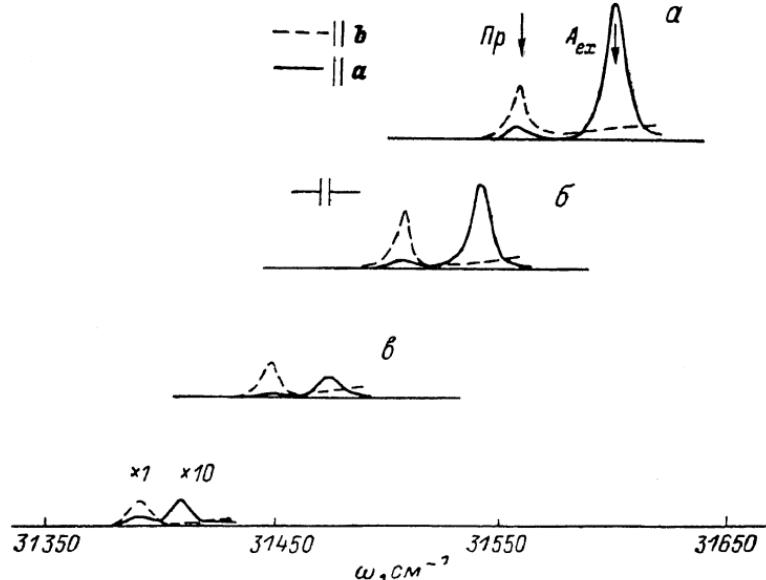


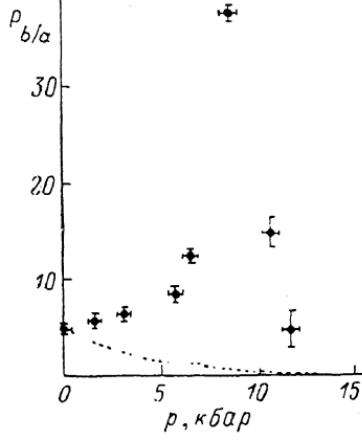
Рис. 2. Начальные участки спектров эксситонного поглощения гидростатически сжатого кристалла дейтеронафталина при $T=4.2\ \text{К}$.

$a - 0, b - 3.1, c - 6.7, g - 8.8\ \text{kbar}$.

вышением давления она вновь появляется в спектре, и интенсивность ее растет. Аналогичным образом ведет себя и пикивая интенсивность полосы поглощения примеси в спектре с поляризацией $\parallel a$. Интегральная интенсивность этих полос повторяет эту зависимость, поскольку полуширина полос с ростом давления меняется незначительно. Следует отметить, что наблюдаемая зависимость от давления полностью обратима и при сбросе давления восстанавливаются все детали первоначального спектра поглощения.

Измерения спектров поглощения проводилось и в поляризации $\parallel b$, однако из-за большой толщины кристаллов не удалось «пробить» полосу В-эксситона и измерить ее полную интенсивность. По этой причине не были измерены и поляризационное отношение $P_{b/a}^0$ для эксситонного дублета, и его зависимость от давления. Начальные участки этих спектров, включающие в себя полосу примеси и А-эксситона, приведены на рис. 2. Как видно из этого рисунка, пикивая интенсивность полос А-эксситона и примеси в поляризации $\parallel a$ уменьшается с ростом давления; таким же образом ведет себя их интегральная интенсивность. При давлении 8.8 кбар интенсивность полос примерно на два порядка меньше, чем их начальное значение при нормальном давлении. В спектре поглощения для поляризации $\parallel b$ полоса А-эксситона отсутствует, а интенсивность примесной полосы уменьшается с ростом давления гораздо медленнее. На рис. 3 приведена зависимость от давления поляризационного отношения $P_{b/a}^0$ для примесной полосы. Экспериментальные точки определены по отно-

шению интегральных интенсивностей полосы в двух поляризациях в серии из четырех измерений. Начальное значение поляризационного отношения при нормальном давлении равно 4.8 ± 0.8 ; с повышением давления оно сначала медленно, а затем быстро растет, достигая максимального измеренного значения 37.2 ± 0.5 при $p=8.8$ кбар, после чего также быстро спадает до величины 4.4 ± 1.6 при $p=11.7$ кбар. Как видно из рис. 3, ошибка измерений растет с увеличением давления, что связано с увеличивающимся перекрытием полос примеси и А-экстона в поляризации $\parallel a$.



Это не позволяет продвинуться в область более высоких давлений, где полоса примеси практически сливаются с полосой А-экстона [12]. Пунктирной линией на рис. 3 приведена зависимость поляризационного отношения $P_{b/a}$ для примесной полосы от давления, вычисленная по формулам теории квазирезонанса в предположении, что поляризационное отношение давыдовского дублета экстонных полос является постоянным.

Рис. 3. Экспериментальная зависимость поляризационного отношения $P_{b/a}$ от давления для примесной полосы.

Таким образом, приведенные экспериментальные результаты однозначно указывают на значительные изменения поляризационных свойств экстонного поглощения кристалла при его сжатии. Возможные причины этого будут обсуждаться в следующей части работы.

2. Обсуждение результатов

Как известно, в гидростатически сжатых кристаллах дейтеронафтилина наблюдается квазирезонанс уровня изотопической примеси и экстонных уровней кристалла [11, 12]. Характерное «отталкивание» примесного уровня от экстонного спектра и делокализации примесного возбуждения хорошо описываются теорией квазирезонанса [13]. Поляризационные свойства примесного поглощения в условиях квазирезонанса определяются формулой

$$P_{\mu_1/\mu_2} = \left[\frac{\epsilon_i - \epsilon_{\mu_2}(0)}{\epsilon_i - \epsilon_{\mu_1}(0)} \right]^2 P_{\mu_1/\mu_2}^0. \quad (1)$$

Здесь ϵ_i — положение примесного уровня; $\epsilon_{\mu_1}(0)$ и $\epsilon_{\mu_2}(0)$ — положение компонент давыдовского экстонного дублета, отвечающих двум ветвям экстонного спектра кристалла; P_{μ_1/μ_2}^0 — поляризационное отношение экстонного дублета; P_{μ_1/μ_2} — поляризационное отношение примесной полосы. Если принять во внимание, что в кристалле нафтилина оптический переход на нижнюю экстонную ветвь $\epsilon_{\mu_1}(k)$ разрешен в поляризации $\perp b$, а на верхнюю ветвь $\epsilon_{\mu_2}(k)$ — в поляризации $\parallel b$, и учесть, что давыдовское расщепление экстонного дублета $D = \epsilon_{\mu_1}(0) - \epsilon_{\mu_2}(0)$, то формула (1) принимает вид

$$P_{b/a} = [E/(E + D)]^2 P_{b/a}^0, \quad (2)$$

где $E = \epsilon_i - \epsilon_{\mu_1}(0)$ — энергия связи экстона на примесном уровне.

Как известно, с ростом давления E монотонно уменьшается, а D увеличивается [12]. Если считать, что поляризационное отношение $P_{b/a}^0$ для экстонного дублета не зависит от давления, то из формулы (2) следует, что поляризационное отношение для примеси должно монотонно уменьшаться. Численный расчет величин E и D в гидростатически сжатом кристалле дейтеронафтилина в условиях квазирезонанса проводился ра-

нее [11, 12]. При помощи этих данных, а также экспериментальных результатов [4] о зависимости D от давления был выполнен расчет зависимости поляризационного отношения примесной полосы от давления (рис. 3. пунктирная линия). Если принять во внимание необычное поведение полосы А-эксситона и учесть, что экспериментальные данные по «отталкиванию» полос и делокализация примесного возбуждения хорошо описываются теорией квазирезонанса, то не остается сомнений, что причиной катастрофического отличия экспериментальных данных от расчетных является изменение поляризационного отношения эксситонного дублета $P_{b/a}^0$ с давлением. Основываясь на полученных результатах, можно определить с помощью (2) поляризационное отношение для эксситонного дублета $P_{b/a}$. При нормальном давлении оно равно 96 ± 16 , затем быстро растет, достигая значения $P_{b/a} = 1060 \pm 20$ при $p = 6.7$ кбар и максимального значения $P_{b/a} = 7400 \pm 100$ при $p = 8.8$ кбар и далее уменьшается до значения $P_{b/a} = 3500 \pm 1300$ при $p = 11.7$ кбар. Изменение поляризационного отношения $P_{b/a}^0$ обусловлено в первую очередь уменьшением интенсивности полосы поглощения А-эксситона, по-видимому, до полного нуля, а затем ее увеличением с повышением давления. Оценки показывают, что вычисленные значения $P_{b/a}^0$ несколько больше тех, которые можно было бы ожидать исходя только из уменьшения интенсивности полосы А-эксситона, что, возможно, свидетельствует и об одновременном увеличении интенсивности полосы В-эксситона.

Чтобы понять необычную зависимость $P_{b/a}^0$ от давления, рассмотрим подробнее возникновение резко поляризованных полос из электронного уровня молекулы. Нижайший оптический переход в свободной молекуле нафталина, принадлежащий к точечной группе симметрии D_{2h} , разрешен на уровень симметрии B_{3u} с энергией 3.97 эВ и поляризован вдоль длинной оси молекулы. Переход на следующий электронный уровень симметрии B_{2u} с энергией 4.45 эВ также разрешен и поляризован вдоль короткой оси молекулы [14]. Кристалл содержит две молекулы в элементарной ячейке в трансляционно-неэквивалентных позициях и имеет пространственную группу симметрии C_{2h}^5 . Позиционная симметрия молекул определяется группой C_i , а операции симметрии фактор-группы кристалла C_{2h} представляют местами трансляционно-неэквивалентные молекулы. Молекулы ориентированы длинными осями приблизительно параллельно оси кристалла, а короткие оси составляют угол $\sim 29^\circ$ с моноклинной осью b [15].

Из электронного уровня молекулы B_{3u} в кристалле возникают две ветви эксситонного спектра, на которые разрешены переходы в точках $k=0$. Оптический переход на нижнюю эксситонную ветвь разрешен в поляризации $\perp b$, а соответствующее состояние обладает симметрией B_u . Переход на верхнюю эксситонную ветвь в состояние с симметрией A_u разрешен в поляризации $\parallel b$ [16]. Поляризационное отношение $P_{b/a}^0$, равное отношению интенсивностей В- и А-эксситонов, определяется в модели ориентированного газа [МОГ] ориентацией дипольного момента молекулярного перехода B_{3u} относительно кристаллографических направлений b и a и должно составлять $1 : 4.2$. Реальное значение $P_{b/a}^0$ значительно отличается от предсказаний МОГ и равно примерно $100 : 1$. Это расхождение было объяснено Мак-Клюром [10] как результат смешивания молекулярного электронного состояния B_{3u} со следующим состоянием B_{2u} , происходящего в кристалле после их трансформации в эксситонные состояния одной симметрии. Такое смешивание состояний под влиянием кристаллического поля было впервые рассмотрено для молекулярных кристаллов Крейгом [6]. Хотя расстояние между электронными уровнями B_{3u} и B_{2u} достаточно велико и составляет ~ 2000 см $^{-1}$, а соответствующие коэффициенты при волновых функциях эксситонного состояния B_{2u} , входящих в возмущенную волновую функцию нижайшего эксситонного состояния, невелики и составляют $\sim 10^{-2}$, влияние смешивания существенно из-за большой силы осциллятора перехода B_{2u} , превышающей примерно на два порядка соответствующую величину для перехода B_{3u} . Изменение поляризационных

свойств экситонного поглощения обусловлено тем, что молекулярные электронные переходы B_{2u} и B_{3u} имеют разную симметрию и ориентацию дипольных моментов. Мак-Клюр показал [10], что возмущенные волновые функции нижайшего экситонного состояния устроены таким образом, что матричные элементы перехода $\parallel b$ складываются, а $\perp b$ вычитаются, что приводит к ослаблению полосы А-экситона и катастрофическому изменению поляризационного отношения $P_{b/a}^0$.

Эффективность смешивания определяется значением коэффициентов при волновых функциях B_{2u} в возмущенной волновой функции нижайшего экситонного состояния. Величина этих коэффициентов, обратно пропорциональная разности энергий молекулярных термов экситонных состояний B_{3u} и B_{2u} , может изменяться при гидростатическом сжатии кристаллов. Действительно, сжатие кристаллов сопровождается сдвигом экситонных полос, причем нерасщепленный молекулярный терм сдвигается как степенная функция относительного изменения объема [4]

$$D_p = D_0 [V_0/V_p]^{3.6 \pm 0.4}. \quad (3)$$

Если учесть, что величина D_0 , определяющая сдвиг электронного уровня молекулы при переходе пар-кристалл (D_p — то же самое при давлении p), составляет 462 см^{-1} для экситонного состояния B_{3u} и 2300 см^{-1} для экситонного состояния B_{2u} , то очевидно, что сжатие будет сопровождаться уменьшением разности энергий молекулярных термов и увеличением соответствующих коэффициентов. Этот процесс может сопровождаться уменьшением интенсивности полосы А-экситона вплоть до нуля с последующим увеличением. Интенсивность полосы В-экситона при этом будет монотонно возрастать, и в предельном случае больших давлений поляризационное отношение нижайшего экситонного состояния будет стремиться к его значению для верхнего экситонного состояния, равному примерно 7 : 1.

Следует отметить, что изменение поляризационного отношения экситонного дублета $P_{b/a}^0$ при сжатии кристаллов может быть вызвано также и изменением ориентации молекул относительно кристаллографических осей. Это тоже может сопровождаться уменьшением интенсивности А-полосы, однако в отличие от рассмотренного выше случая интенсивность В-полосы при этом будет меняться незначительно. Ответ на вопрос, какой из этих механизмов реализуется при гидростатическом сжатии кристалла дейтеронафтилина, может дать прямое измерение интенсивностей обеих полос.

Список литературы

- [1] Джайараман А. // ПНИ. 1986. № 6. С. 3—25.
- [2] Jayaraman A. // Rev. Modern Physics. 1983. V. 55. N 1. P. 65—108.
- [3] Sonnenschein R. // Chem. Phys. 1981. V. 7. N 8. P. 4315—4319.
- [4] Мелетов К. П., Щанов М. Ф. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 1. С. 106—110.
- [5] Gisby J. A., Walmsley S. H. // Chem. Phys. Lett. 1987. V. 13. N 3. P. 275—278.
- [6] Craig D. P. // J. Chem. Soc. 1955. P. 2302—2309.
- [7] Броуде В. Л., Рашиба Э. И., Шека Е. Ф. Спектроскопия молекулярных экситонов. М.: Энергоиздат, 1981. С. 35—51.
- [8] Piermarini G. J. // J. Appl. Physics. 1975. V. 46. N 6. P. 2774—2790.
- [9] Noack R. A., Holzapfel W. B. High Pressure Science and Technology. Plenum, N. Y., 1979. V. 1. P. 748.
- [10] McClure D. S., Schnepp O. // J. Chem. Phys. 1955. V. 23. N 9. P. 1575—1578.
- [11] Мелетов К. П., Щанов М. Ф. // ЖЭТФ. 1985. Т. 89. № 12. С. 2133—2141.
- [12] Gaidai S. I. // Phys. St. Sol. (b). 1987. V. 142. N 1. P. 211—219.
- [13] Рашиба Э. И. // ЖОС. 1957. Т. 2. № 3. С. 568—577; ФТТ. 1962. Т. 4. № 11. С. 3301—3320.
- [14] McClure D. S. // J. Chem. Phys. 1951. V. 22. N 3. P. 1668—1681.
- [15] McClure D. S. Solid State Physics. Academic Press, N. Y., 1959. V. 8. P. 1—47.
- [16] Давыдов А. С. // ЖЭТФ. 1948. Т. 18. № 2. С. 210—218.